

差出人：株式会社東陽テクニカ 汎用計測営業部 [e07mail@toyo.co.jp]
送信日時：2010年4月12日月曜日 15:03
宛先：MATSUURA@ISC.OSAKAC.AC.JP
件名：半導体ホール効果測定セミナーのご案内

各位

株式会社東陽テクニカ
汎用計測営業部

このメールは、当社の担当者と名刺交換させていただいた方、セミナーにお申込みいただいた方や参加いただいた方、各種アンケートに回答くださった方、ホームページにエントリーされた方々にお送りしております。
登録内容の変更や配信不要等の連絡は、お手数ですがこちら
mailto:e07mail@toyo.co.jp (担当：川内) 迄ご連絡のほどお願い致します。

半 | 導 | 体 | ホ | ー | ル | 測 | 定 | セ | ミ | ナ | ー | の | ご | 案 | 内 |

2010年5月11日（火）開催
「ホール測定等によるワイドギャップ半導体の評価・解析方法について」

いつもお世話になっております。
本日は、東陽テクニカ主催「半導体ホール効果測定セミナー」をご案内させていただきます。ぜひこの機会にご参加下さいますよう、お願い申し上げます。

*****半導体ホール効果測定セミナーのお申し込みはこちら*****

↓
< <http://www.toyo.co.jp/bussei/seminar.html> >

<ワイドギャップ半導体（パワーデバイス）>
近年、省電力、省エネルギー、エコ・環境対策の技術が大変注目されております。これらの技術を支える一つにSiC、GaN等のパワーデバイス(ワイドバンドギャップ半導体)があります。このパワーデバイスの高耐電圧化、大電流化、低損失化を実現させるには、ワイドバンドギャップ半導体の基礎物性の評価・解析が不可欠です。

本セミナーでは、大阪電気通信大学の松浦教授をお招きして、ホール効果測定等の手法によるワイドギャップ半導体の評価・解析方法を解説します。基礎的なホール測定原理、パラメータの導出方法をはじめ、キャリア濃度、移動度等のデータからのデバイスの欠陥評価、DLTS法による少数キャリアによる影響等、材料研究の方からデバイスの品質管理の方までご興味頂ける内容です。

また、本セミナーでは東陽テクニカの自社開発品である高温/低温DLTS装置をご紹介します。
ぜひ、この機会にご参加いただけますよう、お願い申し上げます。

<<セミナー開催概要>>

- 開催日：2010年5月11日（火）
- 時間：13:00～16:30（受付開始：12:30）
- 場所：東陽テクニカ 大阪支店（新大阪駅より徒歩5分）
- 受講料：無料（下記URLより事前登録が必要です）

<<セミナー内容（予定）>>

- 1) ホール測定等によるワイドギャップ半導体の評価・解析方法について」

講師 大阪電気通信大学 工学部 電気電子工学科 松浦秀治教授

2) AC磁場ホール/800°C高温ホール測定装置のご紹介（東陽テクニカ）

3) DLTS測定システム（DLTESTシリーズ）のご紹介（東陽テクニカ）

<<お申し込み方法>>

下記のURLから必要事項をご記入の上、お申し込み下さい。

< <http://www.toyo.co.jp/bussei/seminar.html> >

お申込みいただいた方には、開催日の2週間前までに受講票をお送り致します。

<<備考>>

- * セミナーの内容は一部変更になる場合がございます。
- * セミナー会場の収容人数の関係で、定員になり次第お申し込みを終了させていただきます。お早めのお申し込みをお願い致します。
- * 競合会社及びその関係者の方は、お断りさせていただく場合がございます。あらかじめご了承下さい。

お問い合わせ先：

（株）東陽テクニカ 汎用計測営業部（担当：川内）

TEL:03-3279-0771(代表)

FAX:03-3246-0645

mailto:e07mail@toyo.co.jp

<http://www.toyo.co.jp/bussei/>
